# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM **GEBIET DES PATENTWESENS** REC'D 2 8 JUN 2005

# **PCT**

## WIPO INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE **PATENTIERBARKEIT**

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet

Aktenzeichen des Anmeld LO_006 PCT		WEITERES VORGEHEN	siehe Formblatt PCT/IPEA/416
Internationales Aktenzelch PCT/EP2004/003796		Internationales Anmeldedatum (TagMid 08.04.2004	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 11.04.2003
Internationale Patentklass H01J37/32	ifikation (IPK) oder	nationale Klassifikation und IPK	
Anmelder			
LEYBOLD OPTICS G	MBH et al.		
Bei dlesem Berich internationalen von Artikel 36 übermitt	it handelt es sich rläufigen Prüfung telt wird.	um den internationalen vorläufigen beauftragten Behörde nach Artikel	Prüfungsbericht, der von der mit der 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemäß
		t 6 Blätter einschließlich dieses Dec	
3. Außerdem liegen	dem Bericht ANI	AGEN bei; diese umfassen	KDIATIS.
a. 🛛 (an den An	melder und das li	nternationale Büro gesandt) incass	mt 1-4 Blätter; dabei handelt es sich um
zugrun	de liegen, und/od	oung, Anspruchen und/oder Zeichnu	mit 1-4 Blatter; dabei handelt es sich um ngen, die geändert wurden und diesem Bericht die Behörde zugestimmt hat (siehe Regel
☐ Blätter	die frühere Blätt	or or other all and	
internat	lionalen Anmeldu	ng in der ursprünglich eingereichten	Fassung bingungsbit
nur in comp	uterlecharer Form	iro gesandt)i> insgesamt (bitte Art u er/die ein Sequenzprotokoll und/ode n, wie im Zusatzfeld betreffend das iten).	ole dazugehörigen Tabellen enthält/enthalten. Sequenzprotokoli angegeben (siebe Absobaitt
. Dieser Bericht enth			The second state of the second section as
	irundlage des Be		
П <b>=</b>	riorität	scrietas	
☐ Feld Nr. III K		ines Gutachtens über Neuheit, erfin	derische Tätigkeit und gewerbliche
☐ Feld Nr. IV M	langeinde Einheit	lichkeit der Erfindung	
⊠ Feld Nr. V B	egründete Festst nd der gewerblich	Allung pook Arikal or (a)	der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit Erklärungen zur Stützung dieser Feetballter
☐ Feld Nr. VI	estimmte angefül	ellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich Ien Anwendbarkeit; Unterlagen und Inte Unterlagen	der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
☐ Feld Nr. VI B	estimmte angefül estimmte Mängel	ellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich len Anwendbarkeit; Unterlagen und nrte Unterlagen der internationalen Anmeldung	Erklarungen zur Stützung dieser Feststellung
☐ Feld Nr. VI B ☐ Feld Nr. VI B ☐ Feld Nr. VII B ☐ Feld Nr. VIII B	estimmte angefül estimmte Mängel estimmte Bemerk	ellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich Ien Anwendbarkeit; Unterlagen und Inte Unterlagen	Erklarungen zur Stützung dieser Feststellung
☐ Feld Nr. VI B ☐ Feld Nr. VI B ☐ Feld Nr. VII B ☐ Feld Nr. VIII B	estimmte angefül estimmte Mängel estimmte Bemerk	ellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich len Anwendbarkeit; Unterlagen und nrte Unterlagen der internationalen Anmeldung ungen zur internationalen Anmeldu	Erklarungen zur Stützung dieser Feststellung
Feld Nr. VI B  Feld Nr. VII B  Feld Nr. VIII B  Feld Nr. VIII B	estimmte angefül estimmte Mängel estimmte Bemerk	ellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich len Anwendbarkeit; Unterlagen und nrte Unterlagen der internationalen Anmeldung ungen zur internationalen Anmeldu	erklarungen zur Stützung dieser Feststellung
Feld Nr. V B  Feld Nr. VI B  Feld Nr. VII B  Feld Nr. VIII B  Feld Nr. VIII B  atum der Einreichung des A  0.02.2005	estimmte angefül estimmte Mängel estimmte Bemerk Antrags mit der internationa	ellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich ien Anwendbarkeit; Unterlagen und ihrte Unterlagen der internationalen Anmeldung ungen zur internationalen Anmeldun Datum der Ferti	erklarungen zur Stützung dieser Feststellung
Feld Nr. V B  Feld Nr. VI B  Feld Nr. VII B  Feld Nr. VIII B  Feld Nr. VIII B  Teld Nr. VII	estimmte angefül estimmte Mängel estimmte Bemerk Antrags mit der International Patentamt	ellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich en Anwendbarkeit; Unterlagen und nrte Unterlagen der internationalen Anmeldung ungen zur internationalen Anmeldun Datum der Ferti 24.06.2005  en Prüfung Bevollmächtigte	erklarungen zur Stützung dieser Feststellung
Feld Nr. V B  Feld Nr. VI B  Feld Nr. VII B  Feld Nr. VIII B  Feld Nr. VIII B  Teld Nr. VII	estimmte angefül estimmte Mängel estimmte Bemerk Antrags  mit der International Patentamt	ellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich en Anwendbarkeit; Unterlagen und nrte Unterlagen der internationalen Anmeldung ungen zur internationalen Anmeldun Datum der Ferti 24.06.2005  en Prüfung Bevollmächtigte	erklarungen zur Stützung dieser Feststellung

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/003796

_		
_	Feld Nr. I	Grundlage des Berichts
1.	Hinsichtlich eingereicht	der <b>Sprache</b> beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
	bei de □ inte □ Vei	ericht beruht auf einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist: rnationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) öffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) rnationale vorläufige Prüfung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3)
<ol> <li>Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblät Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen die "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt):</li> <li>Beschreibung, Seiten</li> </ol>		nt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als
		ng, Seiten
	1-12	in der ursprünglich eingereichten Fassung
	Ansprüche,	Nr.
	1-25	eingegangen am 10.02.2005 mit Schreiben vom 10.02.2005
	Zeichnunge	n, Blätter
	1/6-6/6	in der ursprünglich eingereichten Fassung
	☐ einem Sequenzpre	Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das otokoll
3,	Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:  ☐ Beschreibung: Seite ☐ Ansprüche: Nr. ☐ Zeichnungen: Blatt/Abb. ☐ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): ☐ etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (genaue Angaben):	
4.	aufgelistete Auffassung (Regel 70.2	chreibung: Seite prūche: Nr. chnungen: Blatt/Abb. uenzprotokoll <i>(genaue Angaben)</i> : aige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen <i>(genaue Angaben)</i> :
	* Wenn : "ersetzt	Punkt 4 zutrifft, können einige oder alle dieser Blätter mit der Bemerkung' versehen werden.

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/003796

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche

Nein: Ansprüche 1,18

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Ja: Ansprüche

Mata Ama di l

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)

Nein: Ansprüche 1-25 Ja: Ansprüche: 1-25

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

siehe Beiblatt

### Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist:

#### siehe Beiblatt

### Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

#### siehe Beiblatt

## Zum Feld V.

1. Im vorliegenden Bescheid wird auf folgende Dokumente verwiesen:

D1: EP-B-0 349 556 (OECHSNER HANS) 18. November 1993 (1 993-11-18) D2: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 2000, Nr. 25, 12. April 2001 (2001-04-12) -& JP 2001 210245 A (SHINCRON:KK), 3. August 2001 (2001-08-03) D3: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 0142, Nr. 39 (E-0930), 21. Mai 1990 (1990-05-21) & JP 2065230 A (MITSUBISHI ELECTRIC CORP), 5. März 1990 (1990-03-05)

2 Art. 33(2) PCT, Neuheit:

- 2.1 Der Gegenstand der Ansprüche 1,18 ist im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu.
- 2.2 Das Dokument DI offenbart (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument): eine Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle (Abb.2; Spalte 8, Zeilen 33-39) mit einem Plasmaraum (6) für ein Plasma (7), elektrischen Mitteln zum Zünden und Erhalt des Plasmas(4), einem auf einem Hochfrequenz-Potential liegendem Extraktionsgitter ((1); Spalte 8, Zeilen 39-42) zum Extrahieren eines Plasmastrahls (8) aus dem Plasmaraum sowie einer Austrittsöffnung, wobei das Extraktionsgitter im Bereich der Austrittsöffnung angeordnet ist (Abb. 2).

  Jeder Strahl weist eine bestimmte Divergenz auf (siehe Punkt 2.3 oben), daher ist der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu.
- 2.3 Aus demselben Grund wie in Punkt 3.2 oben ist der Gegenstand des Anspruchs 18 nicht neu.
- 3. Abhängige Ansprüche 2-10, 11-17, 19-25
- 3.1 Die Ansprüche 2-10, 11-17,19-25 enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit / erfinderische Tätigkeit erfüllen. Einige Ansprüche sind so

unklar dass, kein Unterschied zum Stand der Technik festgestellt werden kann (siehe auch Punkt 2. oben).

- 3.2 Insbesondere, wird der Anmelder darauf hingewiesen dass, der Gegenstand des Anspruchs 4 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Der Gegenstand des Anspruchs 4 unterscheidet sich daher von dem aus DI bekannten dadurch, daß das Extraktionsgitter vom Plasmaraum aus gesehen konkav ausgebildet ist. Die mit der vorliegenden Erfindung zu lösende Aufgabe kann somit darin gesehen werden, daß der Strahlwinkel vergrößert werden muss, um eine breitere Oberfläche zu behandeln. Dokument D2 offenbart eine Hochfrequenz-Ionenstrahlquelle (Zusammenfassung, Abb. 1) mit einem Plasmaraum (1) für ein Plasma und einem Extraktionsgitter (7,8) zum Extrahieren eines Ionenstrahls aus dem Plasmaraum, wobei das Extraktionsgitter vom Plasmaraum aus gesehen konkav ausgebildet ist (Abb. 1). Dokument D2 Iehrt, dass das Extraktionsgitter so gebaut ist, um einen divergenten Strahl zu erzeugen und einen größeren Strahlwinkel zu gewinnen (Absatz 4). Der Fachmann, auf der Suche nach einem Dokument zur Lösung des obengenannten Problems, würde D2 finden und das Extraktionsgitter von D2 ohne erfinderisches Zutun in die Hochfrequenz Plasmastrahlquelle von D1 einbauen.
- 3.3 Darüber hinaus, zeigt das Dokument D1 ein konkaves Extraktionsgitter (7), das auch inhomogen ausgebildet ist; eine Oberfläche zu bestrahlen, die eine Kalotte (36) aufweist; ein Magnet (5); eine Vakuumkammer mit einem Gehäuse (35). Das Extraktionsgitter von D2 beweist Öffnungen die nicht äquidistant sind. DI zeigt ein Extraktionsgitter mit einer Maschenweite, die geringer ist als die Dicke der Raumladungszone zwischen Extraktionsgitter und dem Plasma (Spalte 4, Zeilen 21- 24). In D1 wird das Bestrahlen für die Beschichtung/Modifizierung eine Oberfläche (Spalte 1, Zeilen 3-7) verwendet.

#### Zum Feld VII

1. In der Beschreibung ist das Dokument D2 nicht genannt worden (Regel 6.2 b) PCT).

#### Zum Feld VIII

1. Art. 6 PCT, Klarheit:

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT (BEIBLATT)

. Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/003796

- 1.1 Die Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 6 PCT, weil der Gegenstand der Ansprüche 1,2,3,4,22 unklar ist.
- 1.2 Der Anspruch 1 definiert eine Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle, deren Aufgabe die Erzeugung von einem divergent Plasmastrahl ist, ohne die notwendigen technischen Merkmale zu bieten. Welche technischen Merkmale zum Strahldivergenz führen, ist aus dem Wortlaut des Anspruchs 1 nicht ersichtlich (PCT Richtlinien, 5.35).
- 1.3 Der Begriff "im wesentlich" im Anspruch 1 ist unklar und kann nicht verwendet werden, um den Gegenstand des Anspruchs 1 eindeutig vom Stand der Technik abzugrenzen (PCT Richtlinien, 5.38). Der Anmelder wird darauf hingewiesen dass, jeder Strahl eine bestimmte Divergenz aufweist.
- 1.4 Der Satz "durch eine gezielte Wechselwirkung" in Anspruch 2 ist unklar. Bezogen auf die Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle kann nicht festgestellt werden, ob die Divergenz durch eine "gezielte" oder "nicht gezielte" Wechselwirkung zwischen dem Plasma und dem Extraktionsgitter entsteht.
- 1.5 Der Wortlaut von Anspruch 3 ist unklar. Es scheint, dass mit "Oberfläche" die zu bestrahlende Oberfläche gemeint ist. Ob der Plasmastrahl der Form von einem Teilbereich der obergenannten Oberfläche angepasst ist, kann nicht von einem nicht in Eunktion Plasmastrahlquelle festgestellt werden. Dasselbe-gilt, mutatis mutandis, für angestellt Anspruch 22.





Datum: 10.02.2005 Uhrzeit: 14:40:12



Seite 5 von 8

Reinhardt & Pohlmann Partnerschaft LO\_006 PCT

+49 69 94419381 An: Europäisches Palentamt

- 13 -

# PATENTANSPRÜCHE

- 1. Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle mit einem Plasmaraum (3) für ein Plasma. elektrischen Mitteln (8, 9) zum Zünden und Erhalt des Plasmas, einem auf einem Hochfrequenz Potenzial liegendem Extraktionsgitter (4) zum Extrahieren eines Plasmastrahls (I) aus dem Plasmaraum (3) sowie einer Austrittsöffnung, vorzugsweise zu einer Vakuumkammer (7), wobei das Extraktionsgitter (4) im Bereich der Austrittsöffnung angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Plasmastrahl (I) durch eine gezielte Wechselwirkung zwischen dem Plasma und dem Extraktionsgitter (4) divergent ausgebildet ist.
- Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, dass die Divergenz des Plasmastrahls (I) durch eine nicht planare Form und/oder große Maschenweite des Extraktionsgitter (4) bewirkt ist.
- 3. Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zur Erreichung einer hohen Homogenität der Plasmastromdichte auf zumindest einem Teilbereich einer zu bestrahlenden, gekrümmten, insbesondere kugelförmigen. Oberfläche, der Plasmastrahl (I) der Form von zumindest einem Teilbereich der Oberfläche angepasst ist.
- 4. Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Extraktionsgitter (4) vom Plasmaraum (3) aus gesehen konkav ausgebildet ist, wobei vorzugsweise zumindest ein Teilbereich der Fläche des Extraktionsgitter ein Ausschnitt aus der Mantelfläche eines zylinderartigen Raumkörpers ist.
- Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Extraktionsgitter (4) über zumindest einen Teilbereich seiner Fläche inhomogen ausgebildet ist.

Seite 6 von 8

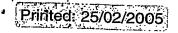
Datum: 10.02.2005 Uhrzeil: 14:40:12

Von: . +49 69 94419381 An: Europäisches Palenlamt

Reinhardt & Pohlmann Partnerschaft LO\_006 PCT

- 14 -

- Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine außerhalb des Plasmaraums (3) angeordnete Blende vorgesehen ist.
- Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Austrittsöffnung in Teilbereichen mit Blenden abgedeckt ist.
- 8. Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Extraktionsgitter (4) Maschen mit einer Maschenweite aufwelst, die geringer ist als die Dicke der Raumladungszone zwischen Extraktionsgitter (4) und dem Plasma im Plasmaraum (3).
- 9. Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Extraktionsgitter (4) Maschen mit einer Maschenweite aufweist, die zumindest so groß ist wie eine Dicke einer Raumladungszone zwischen dem Extraktionsgitter (4) und dem Plasma im Plasmaraum (3).
- Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass Extraktionsgitter (4) Maschen mit einer Maschenweite aufweist, die höchstens so groß ist, dass das Plasma noch im wesentlichen im Plasmaraum (3) verbleibt.
- Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zur Modulierung des Plasmastrahls (I) zumindest eine Blende mit einem elektrischen Potential beaufschlagt ist.
- Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in einer Beschichtungskammer (7), der Austrittsöffnung im wesentlichen gegenüberliegend, eine gekrümmte



Von: . +49 69 94419381 An: Europäisches Palentamt



Datum: 10.02.2005 Uhrzeit: 14:40:12

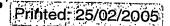


Reinhardt & Pohlmann Partnerschaft LO\_006 PCT

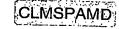
- 15 -

Oberfläche, vorzugsweise eine Kalotte (11), mit Substraten (10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6) angeordnet ist.

- 13. Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zusätzlich zur Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle (1) eine Verdampfungsquelle vorgesehen ist.
- 14. Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Extraktionsgitter (4) aus einem Wolframnetz mit einer Drahtstärke von etwa 0,02 3 mm, bevorzugt 0,1 1 mm, gebildet ist.
- 15. Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Magnet (5) zur Einschließung des Plasmas im Bereich des Plasmaraums (3) vorgesehen ist.
- 16. Vakuumkammer mit einem Gehäuse (2), einer Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle und einer zu bestrahlenden Oberfläche, dadurch gekennzeichnet, dass die Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle (1) nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche ausgebildet ist.
- 17. Vakuumkammer nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass die zu bestrahlende Oberfläche gekrümmt, vorzugsweise eine Kalotte (11) ist und ein oder mehrere Substrate (10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6) umfasst.
- 18. Verfahren zum Bestrahlen einer Oberfläche mit einem Plasmastrahl einer Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle dadurch gekennzeichnet, dass ein divergenter Plasmastrahl (!) verwendet wird und die Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle nach zumindest einem der Ansprüche 1-15 ausgebildet ist.
- 19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass der Plasmastrahl (i) eine Strahlcharakteristik mit einem Divergenzmaß von höchstens n = 16, bevorzugt n=4 aufweist, wobei n ein Exponent einer Cosinus-Verteilungsfunktion ist.



Vop: . +49 69 94419381 An: Europäisches Paleniami



Dalum: 10.02.2005 Uhrzeil: 14:40:12

04726483

Seite B von 8

Reinhardt & Pohlmann Partnerschaft LO\_006 PCT

- 16 -

- 20. Verfahren nach zumindest einem der Ansprüche 18 und 19, dadurch gekennzeichnet, dass die Strahlcharakteristik des Plasmastrahls (I) durch eine gezielte Wechselwirkung zwischen dem Plasma und dem Extraktionsgitter (4) bewirkt wird.
- 21. Verfahren nach zumindest einem der Ansprüche 18 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass eine gezielte Wechselwirkung zwischen einem extrahierten Plasma und zumindest einer außerhalb des Plasmaraums (3) angeordneten Blende eingesetzt wird.
- 22. Verfahren nach zumindest einem der Ansprüche 18 bis 21, dadurch gekennzeichnet, dass zur Erreichung einer hohen Homogenität der Plasmastrahldichte auf zumindest einen Teilbereich einer Oberfläche die Strahlcharakteristik des Plasmastrahls (I) an zumindest einen Teilbereich der bestrahlten Oberfläche angepasst wird.
- 23. Verfahren nach zumindest einem der Ansprüche 18 bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass eine gekrümmte Oberfläche, vorzugsweise eine Kalotte (11),
  vorgesehen ist.
- 24. Verfahren nach zumindest einem der Ansprüche 18 bis 23, dadurch gekennzeichnet, dass durch das Bestrahlen der Oberfläche eine Beschichtung der Oberfläche erfolgt.
- 25. Verfahren nach zumindest einem der Ansprüche 18 bis 24, dadurch gekennzeichnet, dass durch das Bestrahlen der Oberfläche eine Modifizierung und/oder Reinigung der Oberfläche erfolgt.